



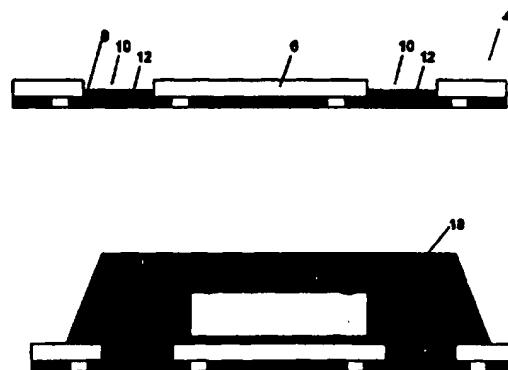
<p>(51) Internationale Patentklassifikation 6 : G06K 19/077, H01L 23/29</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/04611</p> <p>(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 15. Februar 1996 (15.02.96)</p>
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP95/02150</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 6. Juni 1995 (06.06.95)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: P 44 27 309.6 2. August 1994 (02.08.94) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION [US/US]; Old Orchard Road, Armonk, NY 10504 (US).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DRUSCHKE, Frank [DE/DE]; Kauzenhecke 3, D-70597 Stuttgart (DE). DIEMER, Roland [DE/DE]; Lindenstrasse 51, D-71134 Aidlingen (DE). ELSNER, Gerhard [DE/DE]; Feldbergstrasse 67, D-71120 Grafenau (DE). SCHMID, Wolfgang [DE/DE]; Belchenweg 8, D-71154 Nufringen (DE). BRAUN, Reinhold [DE/DE]; Stöckhofstrasse 30, D-71229 Leonberg (DE). GRUBER, Harald [DE/DE]; Wikingerstrasse 3, D-71083 Herrenberg (DE). BECK, Wolfgang [DE/DE]; Steige 41, D-72218 Wildberg (DE). KRATZERT, Rainer [DE/DE]; Herrschaftsgartenstrasse 83, D-71032 Böblingen (DE).</p>	<p>(74) Anwalt: SCHÄFER, Wolfgang; IBM Deutschland Informationssysteme GmbH, Patentwesen und Urheberrecht, D-70548 Stuttgart (DE).</p> <p>(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i></p>	

(54) Title: **PRODUCTION OF A SUPPORT ELEMENT MODULE FOR EMBEDDING INTO SMART CARDS OR OTHER DATA CARRIER CARDS**

(54) Bezeichnung: **HERSTELLUNG EINES TRÄGERELEMENTMODULS ZUM EINBAU IN CHIPKARTEN ODER ANDERE DATENTRÄGERKARTEN**

(57) Abstract

A process is disclosed for producing an IC-module that consists of a thin support element (4) upon which is mounted a semiconductor chip (2). This process also allows the use of IC-components (2) of especially large sizes (macrochips) and various types. The chip is injection moulded so that it has a minimum height without requiring further processing and may be economically surface-mounted. The module may be used both in flexible printed circuit cards (for example in photographic cameras) and in smart cards. In a first step of the process, at least one IC-component (2) is applied on the support element (4), in a second step the IC-component (2) is contacted with the support element (4) and in a third step an injection moulding material (18) is injection moulded around the IC-component (2) so as to envelop it.



(57) Zusammenfassung

Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines IC-Moduls beschrieben, das aus einem dünnen Trägerelement (4) und einem darauf montierten Halbleiter-Chip (2) besteht. Dieses Verfahren erlaubt auch die Verwendung von IC-Bausteinen (2) besonders großer Abmessungen (Makro-Chips) und großer Typenvielfalt. Der Chip-Spritzpreßprozeß ist so dabei ausgelegt, daß eine minimale Bauhöhe, ohne daß eine Nacharbeitung erforderlich ist, erzielt werden kann und dadurch die kostengünstige Oberflächenmontierung der Chips verwendet werden kann. Dieses erfindungsgemäß hergestellte Modul läßt sich sowohl in flexiblen Schaltkreiskarten (Einsatz in z.B. Fotoapparaten) als auch in Chipkarten verwenden. Das erfindungsgemäße Verfahren weist dabei einen ersten Schritt des Aufbringens des mindestens einen IC-Bausteins (2) auf das Trägerelement (4), einen zweiten Schritt des Kontaktierens des mindestens einen IC-Bausteins (2) mit dem Trägerelement (4) und einen dritten Schritt des Spritzpressens einer Spritzpressmasse (18) zur Ummantelung des IC-Bausteins (2) auf.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumänien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

- 1 -

B E S C H R E I B U N G

HERSTELLUNG EINES TRÄGERELEMENTMODULS ZUM EINBAU IN
CHIPKARTEN ODER ANDERE DATENTRÄGERKARTENGebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Trägerelementmoduls, bestehend aus einem Trägerelement und mindestens einem IC-Baustein (Chip) insbesondere mit großen Abmessungen (Makro-Chips), das vorzugsweise für den Einbau in Chipkarten oder andere Datenträgerkarten vorgesehen ist.

Stand der Technik

Die in jüngster Zeit für die Informationsverarbeitung eingesetzten Chipkarten (z.B.: Multifunktionelle Chipkarten oder Telefonkarten) bestehen üblicherweise aus einem ein- oder mehrlagigen isolierten Trägerelementmodul, das z.B. in einer Aussparung eines Trägerlements oder drauf aufliegend den integrierten Halbleiter-Schaltkreis (Chip) trägt.

Die Verdrahtung des Chips mit den Außenkontakten kann gemäß der Lehre der Patentschrift DE-C-3029667 über eine Kontaktierungstechnik, dem sogenannten "wire bonding", durchgeführt werden. Dazu werden die Anschlußpunkte des Chips z.B. über feine Golddrähte mit den Kontaktflächen des Trägerelements verbunden.

Aus dem United States Patent US-A-4,474,292 ist als Kontaktierungsmöglichkeit zwischen dem Chip und den Kontaktflächen des Trägerelements das "Tape Automated Bonding" (TAB) bekannt. Für die Kontaktierung des Chips mit der jeweiligen Verdrahtung, enthalten die Verdrahtungsmuster Kontaktfinger, die in Form einer sogenannten Kontaktspinne von außen in Richtung des

- 2 -

Chipinn r n geführt werden. Der Chip wird dann, z.B. durch Ultraschallverschweißung, an den Enden dieser Kontaktfinger des Schaltkreises aufgebracht.

Eine weitere Möglichkeit der Kontaktierung ist mittels "plated through holes" (PTH) möglich, wie in der UK Patent Anmeldung GB 2 081 974 A beschrieben.

In der weiteren Anmeldung (Aktenzeichen:..., GE994016) wird die Verwendung der als solche bekannten C4-Technik zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zwischen einem IC-Baustein und einem Trägerelement, das für den Einbau in Chipkarten oder andere Datenträgerkarten vorgesehen ist, vorgestellt. Dies ermöglicht eine hohe Integrationen des IC-Bausteins mit einer entsprechend hohen Anzahl von Kontaktierungen zur Kommunikation des IC-Bausteins mit seiner äußeren Umgebung.

Nach der Kontaktierung von Chip und Träger wird der Chip im Träger vergossen oder auf dem Träger mit einem Gießharztropfen ummantelt um Umgebungseinflüsse auszuschalten. Problematisch, insbesondere bei der Herstellung von Chips mit großer Fläche, hat sich dabei jedoch die im wesentlichen konvexe Formgestaltung der Gießharzummantelung erwiesen. Insbesondere bei der Ummantelung großflächiger und damit im Verhältnis Höhe zu Fläche relativ flacher Chips zwingt die nach dem Aushärten verbleibende konvexe und relativ undefinierte Tropfenform zu einer Nachbehandlung z.B. durch Abschleifen um kleinere Bauhöhen erreichen zu können.

Allen bekannten Methoden zur Herstellung von Trägerelementen für IC-Bausteine ist gemeinsam, daß sie Chips großer Abmessungen (Makro-Chips) nicht od r nur mit groß m Aufwand v rw nd n können. Dadurch ist die Herstellung von Massenartik ln mit höchster

- 3 -

Speicherdichte wie Chipkarten und flexiblen Schaltkarten nicht möglich.

Zusammenfassung der Erfindung

Es ist deshalb Aufgabe der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Trägerelementmodulen mit IC-Bausteinen zu finden, die den Einsatz von Chips mit großen Abmessungen (Makro-Chips) ermöglicht.

Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch die Lehre entsprechend des unabhängigen Patentanspruchs 1.

Das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren erlaubt auch die Herstellung von Trägerelementmodulen mit großflächigen Chips (z.B. mit hoher Speicherdichte), wie sie durch den steigenden Informationsbedarf mit wachsenden Anwendungsmöglichkeiten insbesondere der Chipkarten gefordert werden, durch die Möglichkeit Module mit kleiner und definierter Bauhöhe herstellen zu können.

Die Verwendung des Spritzpreßverfahrens mit einer Spritzpreßmasse mit vorgegebenen Eigenschaften ermöglicht durch die definierbare Formgestaltung der Chipummantelung bei dem Spritzpreßvorgang, daß kleine und definierte Bauhöhen und ein geringes Bauvolumen realisiert werden können. Dabei gewährleistet die Spritzpreßmasse einen Schutz des Chips vor Rissen ("Cracks") und Umwelteinflüssen.

Auch lassen sich bei dem erfindungsgemäßen Verfahren Trägerelemente bestehend aus einem Isolator, vorzugsweise faserverstärkte Polymere, und einer metallischen Kontaktebene verwenden, wobei der Chip dann im wesentlichen auf dem Isolator aufsitzt und mit der Kontaktebene verbunden wird.

Die Verwendung eines Trennmittels mit vorgegebenen Eigenschaften ermöglicht ein leichtes und schonendes Ablösen der bei dem Spritzpreßverfahren entstehenden Anspritzstränge von dem Trägerelement, insbesondere wenn dünne faserverstärkte Polymere als Isolator verwendet werden. Das Trennmittel als solches macht damit die Verwendung von einfachen und kostengünstigen Spritzpreßwerkzeugen mit einer seitlichen, auf dem Trägerelement geführten, Anspritzung erst möglich, da ansonsten die Anspritzstücke auf der Trägerelementoberfläche haften bleiben und bei dem erforderlichen Abtrennprozeß der Anspritzstücke die Trägerelementoberfläche beschädigt werden kann.

Eine Kontrollmöglichkeit zur Erkennung der erfolgreich mit dem Trennmittel beschichteten Oberflächenbereiche des Trägerelement kann durch die Verwendung von einfärbbaren Trennmitteln erreicht werden, was zu einer Kontrastierung und damit entsprechend einfachen Erkennbarkeit der mit dem Trennmittel benetzten Bereiche führt.

Durch die Verwendung eines Klebers mit vorgegebenem Eigenschaftsprofil kann eine zuverlässigen Verbindung zwischen dem Chip und dem Trägerelement erzielt werden.

Die erfindungsgemäße Verwendung und Kombination der geforderten Materialien erlaubt zudem einen möglichst kurzen Prozeßzyklus und einen einfachen, schnellen und ökonomischen Modulherstellungsprozeß, der komplett in einer Linie und ohne Zwischenschritte ausgeführt werden kann.

Beschreibung der Zeichnungen

Zur näheren Erläuterung der Erfindung sind im folgenden Ausführungsbeispiele mit Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

Fig. 1A-1D zeigen ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung eines Träger elementmoduls bestehend aus einem Chip und einem Trägerelement,

Fig. 2 zeigt den Spritzpressvorgang in Draufsicht zu der Darstellung aus den Fig. 1,

Fig. 3 zeigt die Problematik der fehlerhaften Ablösung der Anspritzkanäle an einem Beispiel.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

Fig. 1A-1D zeigen ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Herstellung eines Trägerelementmoduls bestehend aus einem Chip 2 und einem Trägerelement 4 durch das Aufbringen des Chips 2 auf das Trägerelement 4 in Schnittbilddarstellung. Das Trägerelement 4 besteht aus einer auf einen Isolator 6 plan aufgebrachten Kontaktebene 8, wobei der Isolator 6 vorzugsweise aus glasfaserverstärktem Epoxidharz oder aus faserverstärktem Polyimid besteht. Das Trägerelement 4 wird in einem weiteren Schritt in eine sogenannte Chipkarte (Smartcard) eingefügt, auf der Daten gespeichert und bearbeitet werden können. Die Kontaktebene 8 des Trägerelements 4 dient dann zur Kontaktierung des Chips 2 mit der Außenwelt, z.B. einem Chipkartenlesegerät, entsprechend den Anwendungen der Chipkarte.

In Fig. 1A werden kreisrunde Durchbrüche 10 in den Isolator 6 für die spätere Verdrahtung des Chips 2 gestanzt. Anschließend wird auf die Unterseite des Isolators 6 eine elektrisch leitende Folie (z.B.: 35 μm Kupferfolie) als die Kontaktebene 8 aufgeklebt, aus der dann naßchemisch die Leiterbahnen, die leitende Mittelzone und die nicht leitenden Streifen herausgeätzt werden. Danach erfolgt die elektrochemische Beschichtung

- 6 -

der leitenden Kupferstrukturen der Kontaktebene 8 mit Nickel und Gold, die dann Ni/Au-Kontakte 12 bilden.

Nun wird, wie in Fig. 1B gezeigt, auf der Oberseite des Isolators 6 in dem Bereich ein Klebetropfen 14 aufgebracht durch den der Chip 2 mit dem Trägerelement 4 mechanisch verbunden werden soll.

Bei der Anwendung des Klebers 14 ist zu unterscheiden zwischen den verschiedenen elektrischen Kontaktierungsmöglichkeiten von Chip 2 zu dem Trägerelement 4, wie sie in einem sich anschließenden Verfahrensschritt ausgeführt werden. Liegen die Anschlußpunkte von Chip 2 und Trägerelement 4 einander gegenüber, wie z.B. bei der TAB- oder der C4-Technik, kommt einer mechanischen Stabilisierung durch die Verwendung des Klebers 14 eine geringere Bedeutung zu oder sie kann sogar auch entfallen, da durch die Kontaktierung bereits eine vielfach ausreichend feste mechanische Verbingung zwischen Chip 2 und Trägerelement 4 erreicht werden kann. Es sollte jedoch sichergestellt werden, daß in den Raum zwischen dem Chip 2 und der Oberfläche des Trägerelement 4 bei eventuell sich anschließenden weiteren Prozeßschritten nicht oder nur geringfügig andere Materialien, wie etwa eine Vergußmasse, ungewollt eindringen kann. Dies könnte ansonsten zu einem Herabsetzen der mechanischen Stabilität des Verbunds aus Chip 2 und Trägerelement 4 zur Folge haben.

Kann durch die Kontaktierung allein keine ausreichend feste mechanische Verbingung zwischen Chip 2 und Trägerelement 4 erreicht werden, oder soll ein mögliches Eindringen eines unerwünschten Materials in den Raum zwischen dem Chip 2 und der Oberfläche des Trägerelement 4 verhindert werden, ist bei der Auswahl des Materials

für den Kleber 14 darauf zu achten, daß dieser eine ausreichende Verarbeitungsdauer aufweist, die eventuell die elektrische Kontaktierung miteinschließt. Insbesondere muß ein vorzeitiges Aushärten verhindert und eine gute Verträglichkeit mit sich anschließenden Temperaturschritten gewährleistet sein. Zu unterscheiden ist hier generell, ob die Anwendung des Klebers 14 vor oder nach der elektrischen Kontaktierung zu erfolgen hat. So läßt sich bei einer Verwendung des Klebers 14 nach der elektrischen Kontaktierung die mechanische Stabilität des Materialverbund des Trägerelementmoduls günstig beeinflussen ohne dabei eine eventuell auftretende negative Beeinflussung durch den Kleber 14 während der Kontaktierung in Kauf nehmen zu müssen.

Bei der Verwendung der "wire bond" Technik wird der Chip 2 mit seiner Rückseite auf dem Trägerelement 4 platziert und die auf der gegenüberliegenden Seite des Chips 2 sich befindenden Anschlußpunkte über feine Drähte mit den Kontaktflächen 12 des Trägerelements 4 verbunden. Bei dem Aufbringen des Klebers 14 auf das Trägerelement 4 ist es wichtig darauf zu achten, daß der Kleber 14 nicht aus dem Raum zwischen der Rückseite des Chips 2 und dem Trägerelement 4 hinaustritt. Ansonsten besteht die Gefahr, daß bei einer in Fig. 1D gezeigten und später zu beschreibenden Spritzpreßverkapselung des Chips 2 die Spritzpreßmasse durch den Kontakt mit dem Kleber 14 nicht ausreichend an dem Modul haftet und es so zu Abrissen kommen kann. Gleichzeitig ist es wichtig sicherzustellen, daß die Kontaktflächen 12 nicht von dem Kleber 14 benetzt werden und damit die elektrische Kontaktierung beeinträchtigen.

Nach dem Aufbringen des Klebers 14 in Fig. 1B erfolgt dann eine Vorhärtung ("pre-cure"), z.B. mit einer Infrarotheizung, Heizplatte, Heizschuh, Heiztisch, Ofen, Umlauf-

oder Heißluftofen, zur Vorfixierung damit der Chip 2 während der nachfolgenden (vollständigen) Aushärtung in Position bleibt. Dem Schritt der Vorhärtung des Klebers 14 folgt die Aushärtung ("final cure") in einem Ofen.

In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1C wird als Kontaktierungsverfahren das "wire bonding" gewählt. Dazu werden die Anschlußpunkte des Chips 2, z.B. einem Makro-Chip mit einer Fläche von beispielsweise 27.2 mm², über feine Metalldrähte 16 (z.B. Gold- oder Aluminiumdrähte) mit den Kontaktflächen des Trägerelements 4 verbunden. Entsprechend kann jedoch jedes andere insbesondere eines der eingangs erläuterten Kontaktierungsverfahren angewandt werden.

Von der unter dem Chip 2 befindlichen dünnen Klebeschicht 14 muß verlangt werden, daß bei den nachfolgenden Prozeßschritten, die unter anderem eine Verkapselung des Chips 2 durch Spritzpressen beinhalten, der Kleber 14 keine Erweichung mehr zeigt. Ansonsten kann während des bei 180°C ablaufenden Spritzpressens der Chip 2 verschoben werden und dabei die Kontaktierungen des Chips 2 mit dem Trägerelement 4, z.B. vorher gebondete Al-Drähte, abreißen. Außerdem muß die Klebeschicht 14 blasenfrei der Raum zwischen Chip 2 und Trägerelement 4 homogen gefüllt sein, da bei der Spritzpreßtemperatur von 180°C die Luft in den in der Klebeschicht 14 möglicherweise eingeschlossenen Blasen zu einer Druckerhöhung führt und somit der Chip 2 entweder abgesprengt oder brüchen kann.

Desweiteren darf der Kleber 14 während der Aushärtung keine flüchtigen Bestandteile (z.B. niedermolekulare Substanzen) freisetzen, da diese ebenfalls auf die Zuverlässigkeit der Verbindung zwischen Chip 2 und Trägerelement 4 rückwirken können. Letztendlich muß aber

die Klebeschicht 14 nach der Aushärtung einen gewissen Grad an Elastizität haben, da das Trägerelement 4 mit den verklebten Chips 2 im Modulherstellungsprozeß mehrfach Biegebeanspruchungen ausgesetzt werden kann (z.B. bei der Verarbeitung als Endlosfilm in aufgerollter Form, wie in Fig. 2 zu sehen).

Bei Verwendung von Klebern mit Füllstoffen (z.B. Keramikpartikeln) kann der thermische Ausdehnungskoeffizient des Klebers auf den Materialverbund aus Trägerelement 4 und Chip 2 eingestellt und damit auf Streßausgleich hin angepaßt werden. Allerdings darf dann die Korngrößenverteilung der Füllstoffpartikel den Wert der maximal erlaubten Schichtdicke des Klebers, z.B. etwa kleiner als $150\text{ }\mu\text{m}$, nicht überschreiten, damit sich diese erforderliche Schichtdicke des Klebers 14 auch erreichen läßt.

Zum Schutz des Chips 2 gegen Bruch und Umwelteinflüsse wird dieser mittels eines Spritzpreßprozesses ("transfer moulding"), wie in Fig. 1D gezeigt, verkapselt, vorzugsweise bei einer Temperatur von etwa 180°C . Das Spritzpreßmaterial 18 muß über die nachfolgend beschriebenen Eigenschaften verfügen: Das Spritzpreßmaterial 18 muß eine hohe Biegefestigkeit (in etwa größer als 7 kp/mm^2 und vorzugsweise größer als 13 kp/mm^2) und einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten (in etwa kleiner als $50 \times 10^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ und vorzugsweise kleiner als $17 \times 10^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) aufweisen, da dann der Materialverbund aus Trägerelement 4, Chip 2, Spritzpreßmasse 18 und eventuell Kleber 14 geringe mechanische Spannungen aufbaut. Mechanische Spannungen können sich ansonsten ungünstig auf die Kontaktierungen, z.B. die Wire Bond-Anschlüsse 16 auf der Oberseite des Chips 2, auswirken und die Zuverlässigkeit und Integrität

- 10 -

des Moduls in Herstellung und Gebrauch negativ beeinflussen.

Außerdem darf das Spritzpreßmaterial 18 während des Erkalstens nur geringfügig schrumpfen, was durch den Zusatz von Füllstoffen erreicht werden kann, da ein zu hoher Schrumpf ebenfalls auf die Wire Bond-Anschlüsse rückwirkt. Darüber hinaus ist eine möglichst kurze Aushärtezeit (vorzugsweise kleiner als eine Minute) der Spritzpreßmasse 18 erforderlich, um sehr kurze Prozeßzeiten bei der Modulherstellung zu erreichen. Weiterhin muß das Spritzpreßmaterial 18 flammbeständig sein und eine gute Haftung zum Chip 2 und dem Trägerelement 4 aufweisen.

Um den Chip 2 vor Korrosion zu schützen, darf das Spritzpreßmaterial 18 nur wenig Feuchte (vorzugsweise kleiner als 1% nach 48h Kochwasserbehandlung) aufnehmen. Das kann sichergestellt werden, wenn eine geeignete, vernetzbare Spritzpreßmasse 18 eingesetzt wird.

Fig. 2 zeigt den Spritzpressvorgang in Draufsicht zu der Darstellung aus Figs. 1. Bei der hier dargestellten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens werden die Trägerelemente 20-34 als Endlosfilm 36 prozessiert, der anschließend in einzelne Chip-Trägerelement-Module getrennt wird. Der Endlosfilm 36 besteht, entsprechend obigen Erläuterungen aus dem Isolator 6, einem dünnen Epoxid-Glasgewebefilm, und der metallischen Kontaktebene 8. Dabei sind in dieser Darstellung durch den nahezu transparenten Isolator 6 die Kontaktebenen der Trägerelemente 20-34 zu sehen. Der Endlosfilm 36 kann zwischen der Prozessierung der einzelnen Schritte vorzugsweise auf eine Rolle aufgewickelt werden und durchläuft in abgewickelter Form

di vorzugsweise als Fertigungslinie aufgereihten Prozeßschritte.

Bei dem Spritzpreßprozeß wie in Fig. 2 gezeigt, werden mit einem Spritzpreßvorgang jeweils acht Trägerelemente 20-34 gleichzeitig verkapselt. Die Spritzpreßmasse 18 stammt von einem Preßling und wird nach kurzem Aufheizen über einen Verteiler 38 und dem angeschlossene Anspritzkanäle 40 an das jeweilige Trägerelement 20-34 herangeführt. Die Führung der Spritzpreßmasse 18 wird dabei durch ein hier nicht dargestelltes Werkzeug sichergestellt, das nach Beendigung des Spritzpreßvorgangs wieder entfernt wird. Dabei härtet das Spritzpreßmaterial 18 ebenfalls in den Anspritzkanälen 40 aus und bleibt nach Entfernen des Werkzeugs wie in Fig 2 dargestellt zurück.

Wie in Fig. 2 ebenfalls zu sehen ist, wird die Spritzpreßmasse 18 in etwa seitlich von den Kanälen 40 an das jeweilige Trägerelement 20-34 herangeführt. Dies erlaubt eine einfache und kostengünstige Gestaltung des Spritzpreßwerkzeuges im Vergleich zu einer Heranführung der Spritzpreßmasse beispielweise von oben heran.

Die gewollt gute Haftung des Spritzpreßmaterials 18 auf dem Trägerelement 4 wirkt sich aber dort sehr nachteilig aus, wo die Anspritzkanäle 40 für die Verkapselung des Chips 2 auf dem Trägerelement 4 verlaufen und mit diesem Kontakt haben, da sie nach dem Spritzpressen wieder entfernt werden müssen. Die Ablösung der Anspritzkanäle 40 führt zu enormen Prozeßproblemen und erschwert eine Verkapselung mittels der Spritzpreßtechnik.

Fig. 3 zeigt die Problematik der fehlerhaften Ablösung der Anspritzkanäle 40 an einem Beispiel. Während des fehlerhaften Ablösens sind hier nicht nur die

- 12 -

Anspritzkanäle 40 entfernt worden, sondern es haben sich auch gleichzeitig der untere linke und die beiden äußeren rechten Chipumhüllungen mitabgelöst. An den abgelösten Stellen wird nun ersichtlich, daß mit dem entfernten Spritzpreßmaterial 18 auch ein Teil des Isolators 6 unerwünschterweise mitentfernt wurde. Dies erkennt man deutlich an dem durch die Gewebeverstärkung entstandene Musterung der Trägerelementoberflächen. Die so beschädigten Oberflächen ermöglichen nun ein unerwünschtes Eindringen von Feuchtigkeit und anderen Partikeln, die zu einer Korrosion und damit zum Ausfall der Chipfunktionen führen können. Dabei ist zu bemerken, daß für die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit des Chips 2 in erster Linie nur die Beschädigungen beim Abriß der Anspritzkanäle 40 eine Rolle spielen, da durch eine entsprechende Kraftwirkung entgegen der beim Abrißvorgang wirkenden Kräfte ein unerwünschtes Ablösen der ummantelten Chips 2 leicht verhindert werden kann.

Um eine Beschädigung der Oberflächen zu vermeiden, wird in einer Ausführungsform der Erfindung vorgeschlagen, die Oberfläche des Endlosfilms 36 bzw der Trägerelemente 20-34 zumindest dort, wo die Anspritzkanäle 40 auf der Oberfläche der Trägerelemente 20-34 verlaufen, mit einem Trennmittel zu passivieren. Solche Trennmittel müssen unter den Bedingungen des Spritzpreßprozesses ihre Trennmittleigenschaften beibehalten, d.h. insbesondere thermisch stabil sein. Desweiteren dürfen geeignete Trennmittel auch unter Prozeßbedingungen nicht flüchtig sein, um eine unkontrollierte Verteilung auf der Trägeroberfläche auszuschließen.

Für eine ökonomische Verwendung des Trennmittels und insbesondere für eine 'online' Anwendung, d.h. eine Anwendung während des Herstellungsprozesses oder im Produktionslauf, ist es ebenfalls erforderlich, daß das

Trennmittel schnell auf der Trägeroberfläche fixiert bzw. vernetzt werden kann, da ansonsten unerwünschte Wartezeiten oder Diskontinuitäten während des Prozeßablaufes auftreten können.

Als Trennmittel eignen sich generell Organosilane mit niedriger Oberflächenspannung, wie z.B. Organofluorosilane oder Alkyl- und Arylalkoxysilane. Unter diesen Organosilanen haben sich als vorteilhaft für eine erfindungsgemäße Verwendung erwiesen:

Phenyltrimethoxysilan, Phenyltriethoxysilan, Phenyltrichlorsilan, Methyltriethoxysilan, Methyltrimethoxysilan, Propyltrimethoxysilan, Ethyltrichlorsilan, Ethyltrimethoxysilan, Diphenyldiethoxysilan, Dimethyldichlorsilan, Dimethyldiethoxysilan, Perfluorooctyltriethoxysilan, Dimethyldimethoxysilan, Triphenylethoxysilan, Triphenylethoxysilan, Dodecyltriethoxysilan, oder dergleichen.

Die genannten Trennmittel können als solche, insbesondere bei einer Applikation separat vom Modulherstellungsprozeß, oder vorzugsweise auch in Form von Lösungen oder Emulsionen in Konzentrationen ab etwa 0,005 Gewichtsprozent appliziert werden. Es sollten möglichst leichtflüchtige Lösungsmittel wie Ethanol, Methanol, iso-Propanol, Wasser, Aceton, Methyläthylketon, Methylenchlorid, Dioxan etc. oder Mischungen derselben, insbesondere mit Wasser, verwendet werden. Zur besseren Steuerung der Reaktivität der angewandten Trennmittel und zur Verbesserung der Stabilität der Lösungen können der Trennmittelflüssigkeit auch Katalysatoren, z.B. Essigsäure oder Salzsäure, zugesetzt werden.

Die Beschichtung des Trägerelements 4 mit dem Trennmittel bzw. deren Lösungen kann durch geeignete Methoden wie

- 14 -

z.B. Drucken, Pinseln, Aufstrichen oder Schreiben mit einem Filzstift erfolgen und auf einfache Art und Weise auch automatisch angewandt werden. Die Trocknung bzw. Aushärtung der Trennmittelschicht muß für das jeweils verwendete Trennmittel bzw. die gewählte Verfahrensweise optimiert werden. Die Applikation und Trocknung/Härtung des Trennmittels kann sowohl "off line", das heißt separat vom Modulherstellungsprozeß, als auch "in line" erfolgen, das heißt während des Modulherstellungsprozesses. Wird das Trennmittel "in line" appliziert, ergibt sich die Möglichkeit, die Trocknung/Härtung simultan mit der Aushärtung des Klebers 14 durchzuführen.

Zur besseren Erkennung der mit dem Trennmittel beschichteten Oberflächenbereiche kann der Trennmittellösung oder -emulsion ein thermisch ausreichend stabiler Farbstoff in geeigneter Konzentration zugesetzt werden. Dafür eignet sich beispielsweise Methylenblau, das z.B. in einer Konzentration von 0,1 bis 3,0 Gewichtsprozent oder vorzugsweise 0,5 bis 1,5 Gewichtsprozent verwandt werden kann.

Im folgenden ist ein erfindungsgemäßes Ausführungsbeispiel für die Herstellung eines Moduls bestehend aus dem Trägerelement 4 mit dem Chip 2 gegeben. Das Verfahren kann sowohl für ein einzelnes Trägerelement 4 oder für eine Vielzahl von Trägerelementen 20-34 auf dem Endlosträger 36 angewandt werden und beinhaltet die Schritte:

- 1.) Herstellung des dünnen Trägerelements als einzelnes Trägerelement 4 oder als Trägerelemente 20-34 auf Endlosfilm 36, bestehend aus faserverstärktem Polymermaterial (z.B.: Epoxidharz, Polyimid, Polycyanatester, BT Harz) versehen mit einer

- 15 -

Cu/Ni/Au - Kontaktebene 8 auf der Unterseite und metallischen Kontaktflächen 12 an der Oberfläche.

- 2.) Auftragen des Trennmittels auf die Oberfläche des Trägerelements 4, 20-34. Der Auftrag des Trennmittels erfolgt mit einem handelsüblichen und mit dem Trennmittel getränkten Schreiber, wie z.B. einem Filzstift, auf die Oberflächenbereiche oder Teile davon, auf denen später die Anspritzstränge für die Verkapselung des Chips 2 verlaufen. Als Trennmittel wird eine 5%-ige Lösung von Phenyltrimethoxysilan in einer Ethanol/Wasser Mischung (95/5) verwendet.

Zur besseren Erkennung der behandelten Oberflächenbereiche wird der Lösung als Farbstoff Methylenblau zu 1% zugesetzt. Die Trocknung/Härtung des Trennmittels erfolgt bei den unter 3.) beschriebenen Parametern.

- 3.) Verkleben des Chips 2 mit einem Epoxidkleber, kurzes Infrarot-Vorhärten zur Fixierung und etwa 1 Minute Aushärten im Ofen bei einer Temperatur von 180°C.
- 4.) Kontaktierung des Chips 2 mit der Außenverdrahtung unter Verwendung von 32 µm dicken Aluminium-Drähten 16 anhand der "wire bond"-Technik.
- 5.) Verkapseln des Chips 2 mit einem Spritzpreßverfahren unter Verwendung der Spritzpreßmasse 18.
- 6.) Entfernen der Anspritzkanäle 40.
- [7.) Ausstanzen der Trägerelemente 20-34 aus dem Endlosträger 36.]

8.) Einbau in die Chipkarte.

A N S P R Ü C H E

1. Verfahren zur Herstellung eines Moduls bestehend aus einem Trägerelement (4) und mindestens einem IC-Baustein (2) zum Einbau in Chipkarten oder andere Datenträgerkarten, mit:

einem ersten Schritt des Aufbringens des mindestens einen IC-Bausteins (2) auf das Trägerelement (4);

einem zweiten Schritt des Kontaktierens des mindestens einen IC-Bausteins (2) mit dem Trägerelement (4);

gekennzeichnet durch

einen dritten Schritt des Spritzpressens einer Spritzpressmasse (18) zur Ummantellung des IC-Baustein (2).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Trägerelement einen Isolator (6), vorzugsweise faserverstärktes Polymer, und eine Kontaktebene (8) aufweist, wobei der IC-Baustein (2) im wesentlichen auf dem Isolator (6) aufsitzt und mit der Kontaktebene (8) verbunden wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem dritten Schritt ein Schritt des Passivierens des Trägerelements (4) an den Stellen, an denen eine Haftung der Spritzpressmasse (18) mit dem Trägerelement (4) nicht gewünscht ist, ausgeführt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Passivieren des Trägerelements (4) mit einem

Trennmittel ausgeführt wird, das Organosilane mit niedriger Oberflächenspannung, insbesondere Organofluorosilane oder Alkyl- und Arylalkoxysilane, Phenyltrimethoxysilan, Phenyltriethoxysilan, Phenyltrichlorsilan, Methyltriethoxysilan, Methyltrimethoxysilan, Propyltrimethoxysilan, Ethyltrichlorsilan, Ethyltrimethoxysilan, Diphenyldiethoxysilan, Dimethyldichlorsilan, Dimethyldiethoxysilan, Perfluorooctyltriethoxysilan, Dimethyldimethoxysilan, Triphenylethoxysilan, Triphenylethoxysilan, Dodecyltriethoxysilan, oder dergleichen aufweist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Trennmittel als solches oder in Form von Lösungen oder Emulsionen in Konzentrationen ab etwa 0,005 Gewichtsprozent appliziert wird, wobei leichtflüchtige Lösungsmittel wie vorzugsweise Ethanol, Methanol, iso-Propanol, Wasser, Aceton, Methylethylketon, Methylenchlorid, Dioxan etc. oder Mischungen derselben, insbesondere mit Wasser, verwendet werden.
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Spritzpressmasse (18) eine hohe Biegefestigkeit (in etwa größer als 7 kp/mm² und vorzugsweise größer als 13 kp/mm²), einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten (in etwa kleiner als $50 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ und vorzugsweise kleiner als $17 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$), eine möglichst kurze Aushärtezeit (vorzugsweise kleiner als eine Minute), Flammbeständigkeit und eine gute Haftung zu dem IC-Baustein (2) und dem Trägerelement (4) aufweist, während des Erhaltens nur geringfügig schrumpft und nur wenig Feuchte (vorzugsweise kleiner als 1% nach 48h Kochwasserbehandlung) aufnimmt.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß vor dem dritten Schritt ein Schritt zur Erhöhung der Haftung des mindestens einen IC-Bausteins (2) auf dem Trägerelement (4) und/oder der mechanischen Stabilisierung des Materialverbunds, mindestens bestehend aus dem IC-Baustein (2) und dem Trägerelement (4), vorgesehen ist.
8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Erhöhung der Haftung des mindestens einen IC-Bausteins (2) auf dem Trägerelement (4) und/oder der mechanischen Stabilisierung des Materialverbunds durch ein Haftmittel (14) bewerkstelligt wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Haftmittel (14) bei den nachfolgenden Prozeßschritten keine Erweichung mehr zeigt, blasenfrei ist, während der Aushärtung keine flüchtigen Bestandteile (z.B. niedermolekulare Substanzen) freisetzt und nach der Aushärtung einen gewissen Grad an Elastizität hat.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß dem Haftmittel (14) Füllstoffe, vorzugsweise Keramikpartikel, zugesetzt werden zur Einstellung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Haftmittels (14) auf den Materialverbund aus Trägerelement (4) und IC-Baustein (2).
11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerelemente (20-34) auf einem Endlosfilm (36) aufgebracht sind und nach Beendigung des Verfahrens in einzelne Trägerelement (4) zerlegt werden.

FIG. 1A

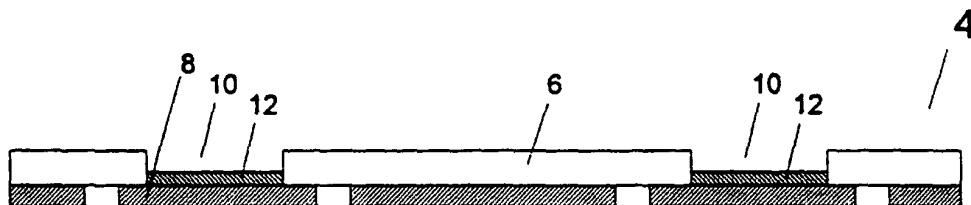


FIG. 1B

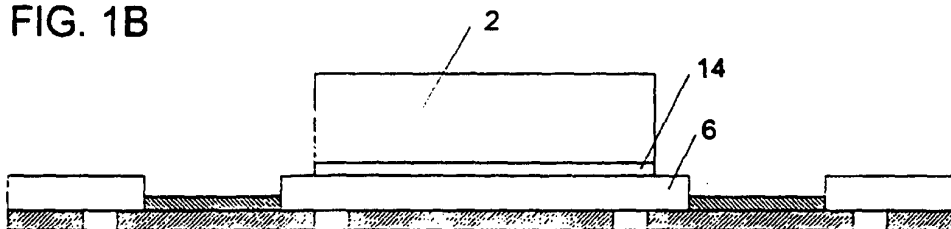


FIG. 1C

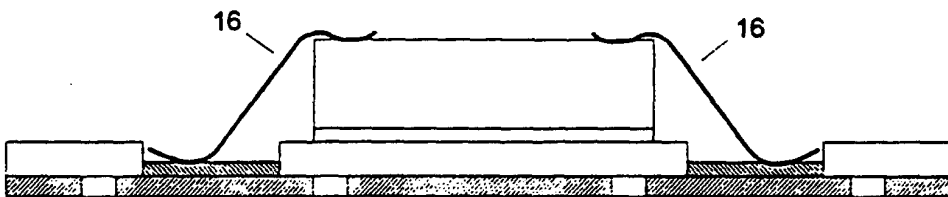
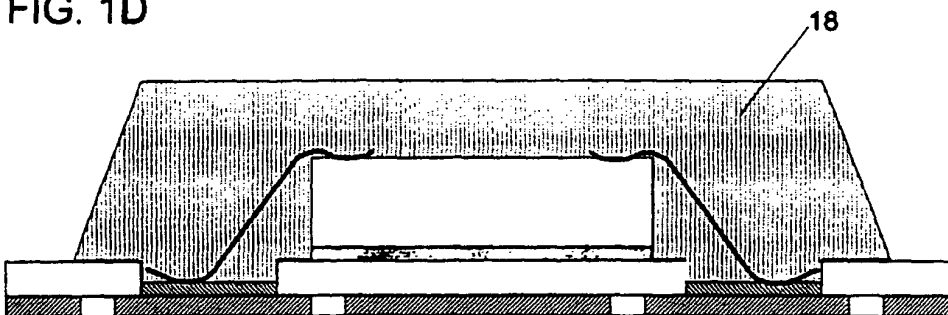


FIG. 1D



2 / 2

FIG. 2

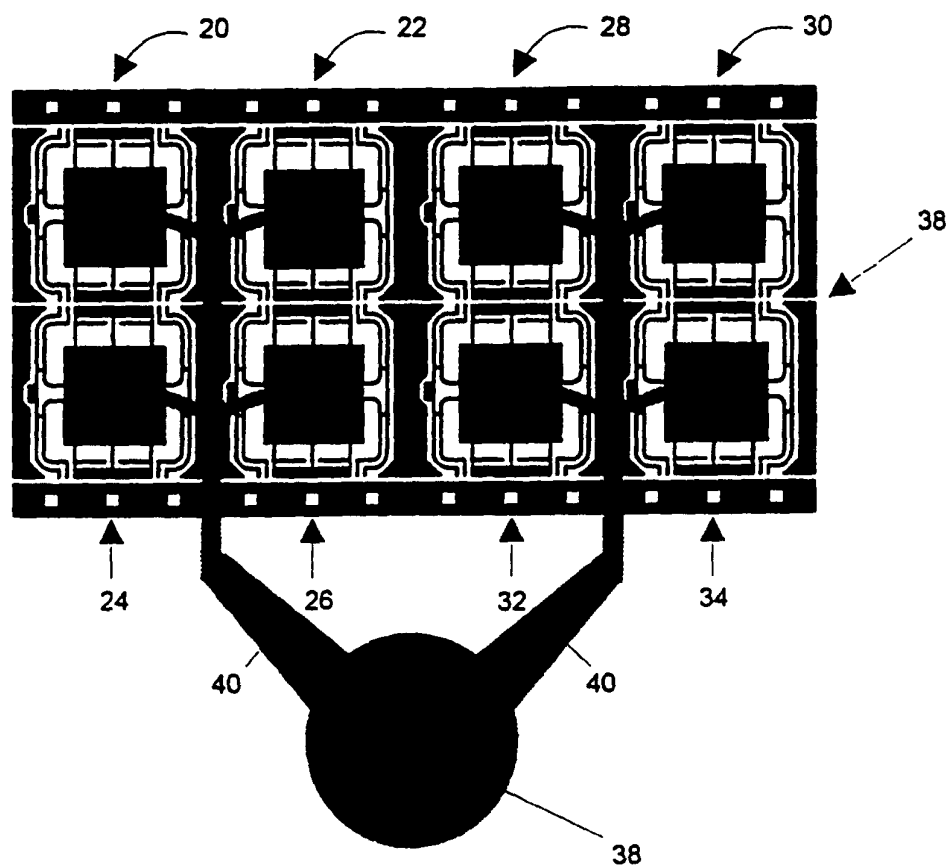
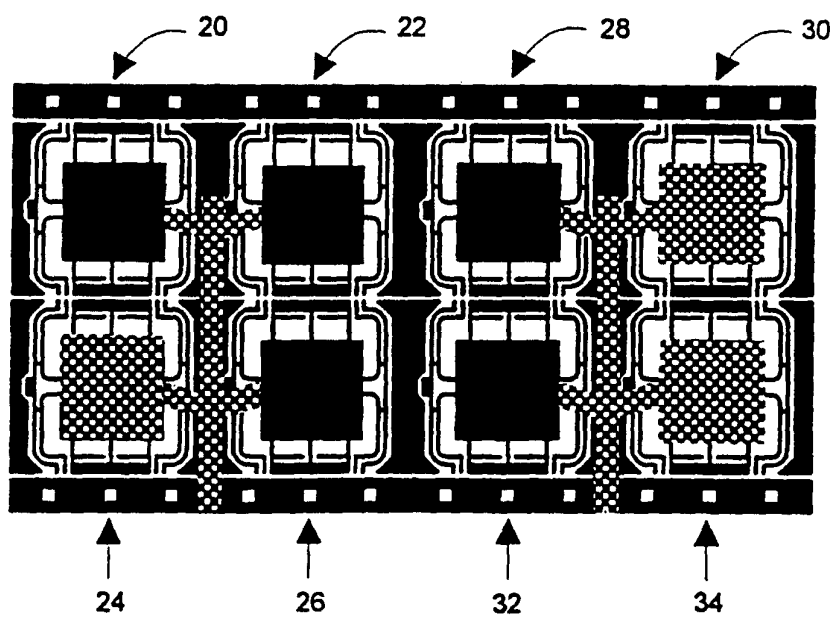


FIG. 3



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat Application No

PCT/EP 95/02150

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 6 G06K19/077 H01L23/29

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 G06K H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP,A,0 500 168 (SCHLUMBERGER INDUSTRIES) 26 August 1992 see the whole document ---	1
A	EP,A,0 344 058 (SCHLUMBERGER INDUSTRIES) 29 November 1989 see claim 2 ---	2,7,8,11
A	EP,A,0 585 949 (MEINEN,T) 9 March 1994 see the whole document ---	3
A	DE,A,42 17 604 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD) 3 December 1992 see the whole document ---	4,5,9
A	EP,A,0 590 780 (DOW CORNING CORP.) 6 April 1994 see the whole document -----	10

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 October 1995

Date of mailing of the international search report

27.10.95

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Herskovic, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter. Appl. Application No

PCT/EP 95/02150

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP-A-500168	26-08-92	FR-A-	2673017	21-08-92
		US-A-	5365655	22-11-94

EP-A-344058	29-11-89	FR-A-	2632100	01-12-89
		DE-D-	68910385	09-12-93
		DE-T-	68910385	19-05-94
		ES-T-	2047691	01-03-94
		JP-A-	2064889	05-03-90
		US-A-	5005282	09-04-91

EP-A-585949	09-03-94	DE-C-	4229639	09-12-93
		DE-A-	4229640	10-03-94
		DE-U-	9218076	21-10-93

DE-A-4217604	03-12-92	JP-A-	4351666	07-12-92
		JP-A-	5043700	23-02-93

EP-A-590780	06-04-94	CA-A-	2104487	01-03-94
		JP-A-	6177185	24-06-94

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter. Aktenzeichen

PCT/EP 95/02150

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 G06K19/077 H01L23/29

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikations symbole)

IPK 6 G06K H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP,A,0 500 168 (SCHLUMBERGER INDUSTRIES) 26.August 1992 siehe das ganze Dokument ---	1
A	EP,A,0 344 058 (SCHLUMBERGER INDUSTRIES) 29.November 1989 siehe Anspruch 2 ---	2,7,8,11
A	EP,A,0 585 949 (MEINEN,T) 9.März 1994 siehe das ganze Dokument ---	3
A	DE,A,42 17 604 (SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD) 3.Dezember 1992 siehe das ganze Dokument ---	4,5,9
A	EP,A,0 590 780 (DOW CORNING CORP.) 6.April 1994 siehe das ganze Dokument -----	10

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11.Oktober 1995

Abschließdatum des internationalen Recherchenberichts

27.10.95

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Herskovic, M

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP-A-500168	26-08-92	FR-A- 2673017	21-08-92
		US-A- 5365655	22-11-94
EP-A-344058	29-11-89	FR-A- 2632100	01-12-89
		DE-D- 68910385	09-12-93
		DE-T- 68910385	19-05-94
		ES-T- 2047691	01-03-94
		JP-A- 2064889	05-03-90
		US-A- 5005282	09-04-91
EP-A-585949	09-03-94	DE-C- 4229639	09-12-93
		DE-A- 4229640	10-03-94
		DE-U- 9218076	21-10-93
DE-A-4217604	03-12-92	JP-A- 4351666	07-12-92
		JP-A- 5043700	23-02-93
EP-A-590780	06-04-94	CA-A- 2104487	01-03-94
		JP-A- 6177185	24-06-94

DOCKET NO: MAS-FIN- 403

SERIAL NO: _____

APPLICANT: B. Goller et al.

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100